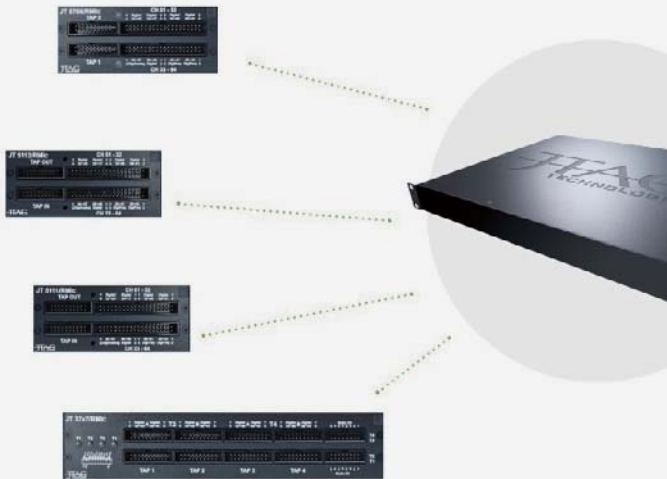


JT 57xx/RMIc- カスタマイズ可能なラックマウントJTAG機器

アナログ測定オプションを備えたモジュラーコントローラおよび I/Oシステム



主な機能

- JTAG コントローラ、デジタルI / O (DIOS) またはミックスドシグナルI/O (MIOS) チャンネル用の4つのモジュールスロット
- 合計で最大256の I/Oチャンネルと8つのTAP
- 高速 (15MHz) および超高速 (40MHz) コントローラオプション
- 1U 19インチ ラックマウント・シャーシ
- ミックスドシグナル測定機能には以下が含まれます
 - 周波数カウンタ
 - プログラマブル・クロック・ジェネレータ
 - パルス幅測定
 - アナログ測定とソース

新しいコンセプトのJTAG基板テスター&プログラマ (JT57xx / RMIc「コンビシステム」) は、さまざまなJTAG (IEEE1149.x) コントローラ、デジタルIOとアナログIO、およびその他の測定機能を提供する最大4つの顧客指定モジュールを収容できる洗練されたベースレベルの19インチ1Uラックマウントシャーシアセンブリで構成されます。

モジュールは、 $\frac{1}{2}$ または $\frac{1}{4}$ ラック幅のいずれかです。以下のモジュールが利用可能です:

JTAGコントローラ・モジュール

- JT 5705/RMIc $\frac{1}{4}$ 幅, 搭載
2 (15MHz) TAPs
64 チャンネル; 56 DIOS, 8 MIOS
- JT 37x7/RMIc $\frac{1}{4}$ 幅, 外部 QuadPod システム
4 (40MHz) TAPs
16 スタティック デジタルIOチャンネル
- JT 37x7/RMIc $\frac{1}{2}$ 幅, 内部 QuadPod システム
4 (40MHz) TAPs
16 スタティック IO チャンネル
最大 64 デジタル IO (DIOS) チャンネル

I/O モジュール

- JT5112/RMIc $\frac{1}{4}$ 幅 搭載
64チャンネル, 56 DIOS, 8MIOS
- JT5111/RMIc $\frac{1}{4}$ 幅 搭載
64デジタル I/O (DIOS)チャンネル

モジュールは、標準的なJTAGコントローラと同じ仕様を提供しますが、チャンネル密度とTAP密度が高く、フットプリントが小さいという利点があります。

モジュールを組み合わせることにより、ユーザはすべてのタイプのシングルボックスJTAGテスタ&プログラマを構成でき、最も費用効果の高いソリューションになります。

JTAG Technologies社は、トップクラスのテストおよびプログラミングソリューションの提供における25年以上の経験を活用して、構造テストと機能テストの両方を実行し、1つのシステム内でパーツをプログラムするために、テストシステムでより大きな能力をますます要求する顧客に対応してきました。

モジュール式のJT57xxc コンビシステムを使用すると、十分な機能を備えたテスターを構築できるため、テストのコストを最小限に抑えることができます。

たとえば、4つのJT5705 / RMIcをラックマウントキャリアに取り付けると、256 IOチャンネル (224 DIOS、32MIOS) を備えた8TAPテスターが生成されます。

JT57xx/RMIcのコンビシステムは、JTAG ProVisionとすべてのランタイムソフトウェアオプションの両方でサポートされています。

新しいコンビシステムを利用するには、最新のJTAG ProVisionに更新することをお勧めします。

JT 57xx/RMIc- カスタマイズ可能なラックマウントJTAG機器

アナログ測定オプションを備えたモジュラーコントローラおよび I/Oシステム

コントローラーモジュールの仕様

	JT 5705/RMIc	JT 37x7/RMIc	JT 37x7/RMIC-DIO-0	JT 37x7/RMIc-DIO-1
モジュールサイズ	1/4 幅	1/4 幅	1/2 幅	1/2 幅
JTAG TAPs	2	4	4	4
TCK max	15 MHz	40 MHz	40 MHz	40 MHz
スタティック I/O'		16	16	16
DIOS	56			64
MIOS	8			
Fast Flash Prog	AW signal	17&27: ETT&AW 07: AW signal	17&27: ETT&AW 07: AW signal	17&27: ETT&AW 07: AW signal
アナログ測定	VDC±15V (最大 8ch)			
アナログ出力	VDC±15V (最大 8ch)			
周波数測定	0-200 MHz			
パルス幅測定	4-8192 ns (ch 35)			
パルス・ジェネレータ	0-62.5 MHz (ch 33)			
SCIL 再構成	可能			

I/O モジュールの仕様

	JT 5112/RMIc	JT 5111/RMIc
ジュール・サイズ	1/4 幅	1/4 幅
DIOS	56	64
MIOS	8	
アナログ測定	VDC±15V (最大 8ch)	
アナログ出力	VDC±15V (最大 8ch)	
周波数測定	0-200 MHz	0-200 MHz
パルス幅測定	4-8192 ns (ch 35)	4-8192 ns (ch 35)
パルス・ジェネレータ	0-62.5 MHz (ch 33)	0-62.5 MHz (ch 33)
SCIL 再構成	可能	可能

JTAG Technologies 社 日本国内総代理店



システムに挑戦する

アンドールシステムサポート株式会社

<https://www.andor.jp>

【お問い合わせ先】

〒140-0004 東京都品川区南品川2-15-8

JTAGソリューションセンター

TEL : 03-3450-7201 FAX : 03-3450-8109

E-mail : jtag@andor.jp

2111-JT57xx RMIc-E-1004

©JTAGTechnologiesのロゴおよび「®」の記号でデザインされたその他の商標は、ヨーロッパおよび/またはその他の国で登録されたJTAGTechnologiesの商標です。 JTAG Technologiesは、予告なしに設計および仕様を変更する権利を留保します。

www.jtag.com



Weareboundary-scan.®